СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Якушенков, Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов: Учебник для вузов [Текст] / Ю.Г. Якушенков. – Изд. 4-е, перераб. и дополн. – М.: ЛОГОС, 1999. – 360 с.

2. Прокофьев О. Е. Методы соединения оптических деталей / О. Е. Прокофьев, Г. Ф. Пищук, В. С. Чередник, Г. А. Куршев. – К.: Техника, 1984. – 129 с.

3. Richard, H. Principle and applications of the background oriented schlieren (BOS) method [Text] / H. Richard, M. Raffel // Measurement Science and Technology. — 2001. — Vol. 12, № 9. — P. 1576–1585. doi:10.1088/0957-0233/12/9/325 5.

4 Meier, G. Computerized background-oriented schlieren [Text] / G. Meier // Experiments in Fluids. — 2002. — Vol. 33, № 1. — P. 181–187. doi:10.1007/s00348-002-0450-7 6.

5,Elsinga, G. E. Assessment and application of quantitative schlieren methods: Calibrated color schlieren and background oriented schlieren [Text] / G. E. Elsinga, B. W. van Oudheusden, F. Scarano, D. W. Watt // Experiments in Fluids. — 2003. — Vol. 36, № 2. — P. 309–325. doi:10.1007/s00348-003-0724-8 7. 6,Hargather, M. J. A comparison of three quantitative schlieren techniques [Text] / M. J. Hargather, G. S. Settles // Optics and Lasers in Engineering. — 2012. — Vol. 50, № 1. — P. 8–17. doi:10.1016/j.optlaseng.2011.05.012

6. Фокус [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.nppfocus.com/Tenevoj_metod_kontrolja_optiki.php

7 Malacara, D. Interferogram Analysis for Optical Testing [Text] / D. Malacara, M. Servin, Z. Malacara. — CRC Press Taylor & Francis Group, 2005. — 546 p. doi:10.1201/9781420027273 9.

8, Malacara, D. Optical Shop Testing [Text] / D. Malacara. — Wiley, 2007. — 862 p. doi:10.1002/9780470135976

9. Garbusi, E. New technique for flexible and rapid measurement of precision aspheres [Text] / E. Garbusi, C. Pruss, J. Liesener, W. Osten // Proc. SPIE, Optical Measurement Systems for Industrial Inspection. — 2007. — Vol. 6616. — P. 661629. doi:10.1117/12.727898

10. Pruss, C. Testing Aspheres [Text] / C. Pruss, E. Garbusi, W. Osten // Optics and Photonics News. — 2008. — Vol. 19, № 4. — P. 24–29. doi:10.1364/opn.19.4.000024

11. Garbusi, E. Interferometer for precise and flexible asphere testing [Text] / E. Garbusi, C. Pruss, W. Osten // Optics Letters. — 2008. — Vol. 33, № 24. — P. 2973–2975. doi:10.1364/ ol.33.002973

12. Seifert, L. Measuring aspheres with a chromatic Fizeau interferometer [Text] / L. Seifert, C. Pruss, B. D rband, W. Osten // Proc. SPIE, Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VI. — 2009. — Vol. 7389. — P. 738919. doi:10.1117/12.830658

13.Горелик С.Л.,Кац Б.М., Киврин В.И. Телевизионные измерительные системы.-М.Связь,1980,168 с.

14. Порєв, В. А. Концептуальні аспекти використання приладів з електронним розгортанням зображення для аналізу оптичних полів [Текст] / В. А. Порєв, Г. В. Порєв // Наукові вісті НТТУ «КПІ». — 2000. — № 1. — С. 56–61.

15.Панов, В. А. Справочник конструктора оптико-механических приборов [Текст] / В. А. Панов, В. В. Кулагин, Г. В. Погарев, М. Я. Кругер и др.; под. ред. М. Я. Кругера. — Ленинград: Машиностроение, 1967. — 760 с.

16 ГОСТ 14887-80 Клеи оптические. Типы

17. Прокофьев, О. Е. Методы соединения оптических деталей [Текст] / О. Е. Прокофьев, Г. Ф. Пищук, В. С. Чередник, Г. А. Куршев. — К.: Техніка, 1984. — 128 с.

18.Учбові Матеріали для студентів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://um.co.ua/4/4-14/4-147653.html

19. Закономірності поведінки точності оптичних призм зовнішнього відбиття / В. П. Маслов [Текст] // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. : Приладобудування. - 2014. - Вип. 47. - С. 95-102.

20. Маслов В. П. Физико-технологические проблемы обеспечения работоспособности оптоэлек- тронных сенсорных приборов при экстремальных условиях [Текст] // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2005. – № 1. – С. 57 – 62.

21.Маслов В. П. Фізико-технологічні проблеми з’єднання прецизійних деталей оптико- електронних приладів: монографія. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 160 с.

22.Патент на корисну модель №39789, Україна, МПК G01N 21/21 Пристрій для контролю якості оптичних матеріалів / Венгер Є. Ф., Сердега Б. К., Маслов В. П., Качур Н. В. Заяв- ка № u 2008 12413 від 22.10.2008. Опубл. 10.03.2009. Бюл. № 5

23.Міхеєнко Л.А., Мамута М.С. Основи конструювання приладів. [Текст]// Л.А. Міхеєнко, М.С. Мамута. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 202с.

24. Луцьк НТУ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/tf/m_ta_pfkm/2014/14-28/page12.html

25. Markina O.M. Development of the television control method of transparent material in the optical rangei [in Ukraine] / O.M. Markina, N.V. Kachur, V.P. Maslov // Quality, standardization, control: Theory and Practice: XIV International Scientific and Practical Conference., 23-26 september 2014 . – Odessa, 2014. – C. 88-89.

26. Patent №95934, Ukraine. MPK (2006.01) G01N 25/72. Control method of optically transparent materials [in Ukraine] / O.M. Markina, N.V. Kachur, Markina applicants OM Kachur NV – № u 2014 08494, submitted 25.07.2014; published. 12.01.2015, Bulletins. № 1.– 2 c.

27. Markina O.M. Evaluation of measurement errors geometrical parameters by means of television information and measurement systems [in Ukraine] / M. O. Markin, O. M. Markina // Vestnik NTU "KPI". Series of instrumentation. – 2009. – Released. 38. – C. 102-106.

28. Бондар К.В. Особливості налаштування оптико-електронної вимірювальної системи для визначення дефектів клейових з'єднань оптичних деталей / К.В. Бондар, О.М. Маркіна // Харків. – 2016 .

29. Розроблення стартап-проекту [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://psnk.kpi.ua/docs/graduate/Start-up_recommendation.pdf